

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60325

Troisième édition
Third edition
2002-06

**Instrumentation pour la radioprotection –
Contaminamètres et moniteurs de
contamination alpha, bêta et alpha/bêta
(énergie des bêta >60 keV)**

iTeh STANDARD PREVIEW
Radiation protection instrumentation –
Alpha, beta and alpha/beta (beta energy
>60 keV) contamination meters and monitors

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0dfef584-1fa7-4750-9b08-deb4766ee7af/iec-60325-2002>



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60325:2002

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de :

- **Site web de la CEI** (www.iec.ch)
- **Catalogue des publications de la CEI**
Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.
- **IEC Just Published**
Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.
- **Service clients**
Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:
Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** (www.iec.ch)
- **Catalogue of IEC publications**
The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.
- **IEC Just Published**
This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.
- **Customer Service Centre**
If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:
Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60325

Troisième édition
Third edition
2002-06

**Instrumentation pour la radioprotection –
Contaminamètres et moniteurs de
contamination alpha, bêta et alpha/bêta
(énergie des bêta >60 keV)**

iTeh STANDARD PREVIEW
Radiation protection instrumentation –
(standards.iteh.ai)
Alpha, beta and alpha/beta (beta energy
>60 keV) contamination meters and monitors

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0dfef584-1fa7-4750-9b08-deb4766ee7af/iec-60325-2002>

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

W

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	6
1 Domaine d'application et objet.....	8
2 Références normatives.....	10
3 Termes et définitions.....	12
4 Unités.....	18
5 Classification des ensembles.....	18
6 Caractéristiques générales.....	20
6.1 Appareils de détection.....	20
6.2 Aptitude à la décontamination.....	20
6.3 Etanchéité.....	20
6.4 Seuil d'alarme.....	20
6.5 Affichage des appareils.....	22
6.6 Etendue de mesure.....	22
6.7 Afficheur.....	24
6.8 Chocs mécaniques.....	24
6.9 Mise en service et opérations de maintenance de l'électronique.....	24
7 Procédures générales d'essai.....	24
7.1 Essais.....	24
7.2 Généralités.....	26
7.3 Bruit de fond.....	26
7.4 Fluctuations statistiques.....	28
8 Caractéristiques électriques.....	28
8.1 Fluctuations statistiques.....	28
8.2 Temps de réponse.....	30
8.3 Interdépendance entre le temps de réponse et les fluctuations statistiques.....	32
8.4 Dérive du seuil d'alarme.....	32
8.5 Essai de temps de préchauffage (pour ensembles portables).....	34
8.6 Résolution en temps.....	36
8.7 Protection contre les surcharges.....	38
8.8 Palier de fonctionnement (pour ensembles de détection seulement).....	38
8.9 Seuil (pour ensembles de détection seulement).....	40
9 Caractéristiques sous rayonnement.....	40
9.1 Généralités.....	40
9.2 Rendement de l'appareil.....	40
9.3 Variation de la réponse à la surface du détecteur.....	42
9.4 Erreur relative intrinsèque.....	44
9.5 Variation de la réponse en taux d'émission surfacique avec l'énergie du rayonnement.....	46
9.6 Réponses à d'autres rayonnements ionisants.....	48
9.7 Taux de comptage du bruit de fond.....	52
10 Influence de l'environnement.....	54
10.1 Température ambiante.....	54
10.2 Humidité relative.....	56
10.3 Alimentation électrique.....	56
10.4 Compatibilité électromagnétique.....	62

CONTENTS

FOREWORD.....	7
1 Scope and object.....	9
2 Normative references	11
3 Terms and definitions	13
4 Units.....	19
5 Classification of assemblies.....	19
6 General characteristics.....	21
6.1 Detection assemblies	21
6.2 Ease of decontamination	21
6.3 Sealing.....	21
6.4 Alarm threshold	21
6.5 Instrument indication	23
6.6 Effective range of measurement.....	23
6.7 Display.....	25
6.8 Mechanical shocks	25
6.9 Setting up and maintenance facilities for electronic equipment.....	25
7 General test procedures.....	25
7.1 Tests.....	25
7.2 General	27
7.3 Background.....	29
7.4 Statistical fluctuations.....	29
8 Electrical characteristics.....	29
8.1 Statistical fluctuations	29
8.2 Response time	31
8.3 Interrelationship between response time and statistical fluctuations	33
8.4 Alarm threshold drift.....	33
8.5 Warm-up time test (for portable assemblies).....	35
8.6 Resolution time	37
8.7 Overload protection.....	39
8.8 Operating plateau (for detection assemblies only)	39
8.9 Threshold (for detection assemblies only)	41
9 Radiation characteristics	41
9.1 General	41
9.2 Instrument efficiency	41
9.3 Variation of response over the surface of the detector	43
9.4 Relative intrinsic error	45
9.5 Variation of surface emission rate response with radiation energy.....	47
9.6 Response to other ionizing radiations.....	49
9.7 Background count rate	53
10 Environmental influences.....	55
10.1 Ambient temperature	55
10.2 Relative humidity.....	57
10.3 Power supply.....	57
10.4 Electromagnetic compatibility	63

11	Stockage	66
11.1	Cas général	66
11.2	Choc mécanique.....	66
12	Documentation	66
12.1	Certificat d'identification	66
	Tableau 1 – Conditions de référence et conditions normales d'essai.....	70
	Tableau 2 – Essais effectués dans les conditions normales d'essai	72
	Tableau 3 – Essais effectués avec variation des grandeurs d'influence.....	74

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60325:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0dfef584-1fa7-4750-9b08-deb4766ee7af/iec-60325-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0dfef584-1fa7-4750-9b08-deb4766ee7af/iec-60325-2002>

11 Storage	67
11.1 General	67
11.2 Mechanical shock	67
12 Documentation	67
12.1 Identification certificate	67
Table 1 – Reference conditions and standard test conditions	71
Table 2 – Test performed under standard test conditions	73
Table 3 – Test performed with variation of influence quantities	75

iTeh STANDARD PREVIEW **(standards.iteh.ai)**

[IEC 60325:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0dfef584-1fa7-4750-9b08-deb4766ee7af/iec-60325-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0dfef584-1fa7-4750-9b08-deb4766ee7af/iec-60325-2002>

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**INSTRUMENTATION POUR LA RADIOPROTECTION –
CONTAMINAMÈTRES ET MONITEURS DE CONTAMINATION
ALPHA, BÊTA ET ALPHA/BÊTA (ÉNERGIE DES BÊTA >60 keV)**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60325 a été préparée par le sous-comité 45B: Instrumentation pour la radioprotection, du comité d'études 45 de la CEI: Instrumentation nucléaire.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition, parue en 1981, dont elle constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
45B/354/FDIS	45B/363/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication restait valable jusqu'en 2007. A cette date, selon la décision du comité, la publication sera:

- reconfirmée;
- retirée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION –
ALPHA, BETA AND ALPHA/BETA (BETA ENERGY >60 keV)
CONTAMINATION METERS AND MONITORS**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60325 has been prepared by subcommittee 45B: Radiation protection instrumentation, of IEC technical committee 45: Nuclear instrumentation.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1981. This third edition constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
45B/354/FDIS	45B/363/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INSTRUMENTATION POUR LA RADIOPROTECTION – CONTAMINAMÈTRES ET MONITEURS DE CONTAMINATION ALPHA, BÊTA ET ALPHA/BÊTA (ÉNERGIE DES BÊTA >60 keV)

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale est applicable aux radiamètres et moniteurs conçus pour la mesure directe ou la détection directe de la contamination des surfaces par des radio-nucléides émetteurs alpha et/ou bêta et qui comprennent au moins:

- un ensemble de détection (comprenant un compteur γ , un détecteur à scintillation ou un détecteur à semi-conducteur, etc.) qui peut être soit connecté rigidement ou par un câble flexible à un ensemble de mesure, soit intégré à cet ensemble;
- un ensemble de mesure.

Certains contaminamètres ou moniteurs sont constitués de plusieurs ensembles de détection et de mesure. Il est possible, dans ce cas, d'interchanger les ensembles de mesures et de détection. La conformité à la norme peut-être obtenue:

Lorsque toutes les combinaisons ensemble de détection et ensemble de mesure sont en conformité avec les exigences de la présente norme.

ou

Lorsque chaque ensemble de détection et chaque ensemble de mesures pris séparément est en conformité avec les exigences de la présente norme.

NOTE Dans ce dernier cas, l'application de ces critères assure la conformité à la présente norme, mais n'implique pas que l'étalonnage d'une combinaison particulière d'instruments est valable pour une autre combinaison.

Dans ce dernier cas, l'application de ces critères pourrait permettre à un acheteur d'utiliser des combinaisons d'ensembles provenant de différents constructeurs en toute confiance.

La norme est applicable aux appareils suivants:

- contaminamètres de surface pour les alpha;
- moniteurs de contamination de surface pour les alpha;
- contaminamètres de surface pour les bêta;
- moniteurs de contamination de surface pour les bêta;
- contaminamètres de surface pour les alpha/bêta;
- moniteurs de contamination de surface pour les alpha/bêta.

Ces deux derniers sont des équipements qui permettent de déterminer simultanément la contamination alpha et bêta et d'indiquer la contribution de chacun de ces rayonnements à la mesure:

- Contaminamètres de surface pour les alpha (bêta, alpha/bêta)

Ensemble comprenant un ou plusieurs détecteurs de rayonnement et les ensembles ou éléments fonctionnels associés, et destinés à mesurer le taux d'émission surfacique alpha (bêta, alpha/bêta) liée à la contamination de la surface contrôlée.

- Moniteur de contamination de surface pour les alpha (bêta, alpha/bêta).

La norme est également applicable aux ensembles destinés à des applications particulières et aux ensembles spécifiquement conçus pour des surfaces de nature particulière. Cependant, certaines exigences peuvent être modifiées ou complétées, selon les exigences spécifiques à ces appareils.

RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION – ALPHA, BETA AND ALPHA/BETA (BETA ENERGY >60 keV) CONTAMINATION METERS AND MONITORS

1 Scope and object

This International Standard is applicable to radiation meters and monitors designed for the direct measurement or the direct detection of surface contamination by alpha and/or beta radiation emitting nuclides and which comprise at least:

- a detection assembly (comprising γ counter tube, scintillation detector or semiconductor detector, etc), which may be connected either rigidly or by means of a flexible cable or incorporated into a single assembly.
- a measurement assembly.

Some meters and monitors consist of detection assemblies and measurement assemblies where it is possible to separate the detector assembly and use alternative detection assemblies. Conformity with the standard can either be achieved by:

All combinations of the detection assembly and the measurement assembly conforming to the requirements of this standard.

or

The detection assembly and the measurement assembly separately conforming to the relevant parts of this standard in isolation.

NOTE The use of the latter criteria verifies conformance with this standard but does not infer that calibration of a particular combination of instruments is interchangeable with any other combination.

The use of the latter criteria could allow a purchaser to use combinations of assemblies from different manufacturers with confidence.

The standard is applicable to:

- alpha surface contamination meters;
- alpha surface contamination monitors;
- beta surface contamination meters;
- beta surface contamination monitors;
- alpha/beta surface contamination meters;
- alpha/beta surface contamination monitors.

The latter two are equipment capable of determining alpha and beta contamination simultaneously and displaying the measurement of either:

- Alpha (beta, alpha/beta) surface contamination meter
An assembly including one or more radiation detectors and associated assemblies or basic function units, designed to measure alpha (beta, alpha/beta) surface emission rate associated with the contamination of the surface under examination.
- Alpha (beta, alpha/beta) surface contamination monitor.

This standard is also applicable to special purpose assemblies and to assemblies specifically designed for a surface of a particular nature. However, some of the requirements may need to be amended or supplemented according to the particular requirements applicable to such assemblies.

Si un ensemble est conçu pour remplir plusieurs fonctions à la fois, il faut qu'il réponde aux exigences concernant chaque fonction. Si, d'autre part, il est conçu pour remplir une seule fonction et qu'il est en plus capable d'effectuer d'autres fonctions, il faut qu'il réponde aux exigences concernant la première fonction; il convient qu'il réponde aussi aux exigences concernant les autres fonctions.

Cette norme ne s'applique pas aux appareils de surveillance ou de mesure des rayonnements conçus pour mesurer ou détecter des bêta d'énergie $E_{\max} < 60$ keV.

L'objet de cette norme est d'établir des exigences standards et de donner des exemples de méthodes acceptables, ainsi que de spécifier les caractéristiques générales, les conditions générales d'essai, les caractéristiques relatives aux rayonnements, à la sécurité électrique, à l'environnement, et les exigences concernant le certificat d'identification pour les contaminateurs et moniteurs de contamination alpha, bêta et alpha/bêta.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60038:1983, *Tensions normales de la CEI*

CEI 60050-151:2001, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Partie 151: Dispositifs électriques et magnétiques*

CEI 60050(393):1996, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 393: Instrumentation nucléaire: Phénomènes physiques et notions fondamentales*

CEI 60050(394):1995, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 394: Instrumentation nucléaire: Instruments*

CEI 60068 (toutes les parties), *Essais d'environnement*

CEI 61000-4-2:1995, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 2: Essais d'immunité aux décharges électrostatiques*

CEI 61000-4-3:1995, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques*

CEI 61000-4-4:1995, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves*

CEI 61000-4-5:1995, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc*

CEI 61000-4-6:1996, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 6: Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques*

CEI 61000-4-11:1994, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 11: Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension*

If an assembly has been designed to carry out combined functions, it must comply with the requirements pertaining to these different functions. If, on the other hand, it has been designed to perform one function, and, in addition, it is also capable of carrying out other functions, then it must comply with the requirements for the first function, and it would be desirable for it to comply with requirements pertaining to the others.

This standard is not applicable to radiation monitors or meters designed to measure or detect beta particles with $E_{\max} < 60$ keV.

The object of this standard is to lay down standard requirements and to give examples of acceptable methods, and also to specify general characteristics, general test conditions, radiation characteristics, electrical safety, environmental characteristics, and the requirements of the identification certificate for alpha, beta and alpha-beta contamination meters and monitors.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60038:1983, *IEC standard voltages*

IEC 60050-151:2001, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 151: Electrical and magnetic devices*

IEC 60050(393):1996, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 393: Nuclear instrumentation: Physical phenomena and basic concepts*

IEC 60050(394):1995, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 394: Nuclear instrumentation: Instruments*

IEC 60068 (all parts): *Environmental testing*

IEC 61000-4-2:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measuring techniques – Section 2: Electrostatic discharge immunity test*

IEC 61000-4-3:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test*

IEC 61000-4-4:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test*

IEC 61000-4-5:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 5: Surge immunity test*

IEC 61000-4-6:1996, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields*

IEC 61000-4-11:1994, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests*

CEI 61187:1993, *Équipement de mesures électriques et électroniques – Documentation*

ISO 7503 (toutes les parties), *Évaluation de la contamination de surface*

ISO 8769:1988, *Sources de référence pour l'étalonnage des moniteurs de contamination de surface – Émetteurs bêta (énergie bêta maximale supérieure à 0,15 MeV) et émetteurs alpha*

ISO 11929-1:2000, *Détermination de la limite de détection et du seuil de décision des mesurages des rayonnements ionisants – Partie 1: Principes fondamentaux et application aux mesurages par comptage, sans l'influence du traitement de l'échantillon*

3 Termes et définitions

La terminologie générale concernant la détection et la mesure des rayonnements ionisants et l'instrumentation nucléaire est indiquée dans la CEI 60050(393) et la CEI 60050(394).

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1

étendue de mesure

étendue des valeurs de la grandeur à mesurer dans laquelle les performances d'un contaminamètre ou d'un moniteur satisfont aux exigences de la présente norme

3.2

taux d'émission surfacique d'une source, $q/2\pi$

nombre de particules d'un type donné et d'énergie supérieure à un seuil donné, sortant de la surface d'une source par unité de temps

3.3

rendement d'une source, ϵ_s

rapport entre le nombre de particules d'un type donné sortant de la face avant de la source ou de sa fenêtre avec une énergie supérieure à une énergie donnée par unité de temps (taux d'émission surfacique) et le nombre de particules du même type créées ou libérées par la source par unité de temps dans l'épaisseur de la source (cas d'une source mince) ou dans l'épaisseur de sa couche de saturation (cas d'une source épaisse)

3.4

source de rendement élevé

source pour laquelle le rendement des particules d'énergie supérieure à 5,9 keV, y compris les particules rétrodiffusées, est supérieur à 0,25. (Cette définition s'applique aux émetteurs bêta dont l'énergie maximale est >150 keV).

3.5

source de petite surface

source dont la plus grande dimension linéaire de la surface active n'excède pas 1 cm

3.6

réponse en taux d'émission surfacique (rendement de l'appareil)

dans des conditions définies précisées par le constructeur (surface sensible du détecteur, surface sensible de la source et distance entre la source et le détecteur), la réponse en taux d'émission surfacique (rendement) du détecteur utilisé conjointement avec l'appareil est le rapport d'un nombre de particules détectées (par exemple le nombre de coups par unité de temps, corrigé du bruit de fond) au nombre de particules de même type émises par la source de rayonnement dans le même intervalle de temps (taux d'émission surfacique conventionnellement vrai)

IEC 61187:1993, *Electrical and electronic measuring equipment – Documentation*

ISO 7503 (all parts), *Evaluation of surface contamination*

ISO 8769:1988, *Reference sources for the calibration of surface contamination monitors – Beta-emitters (maximum beta energy greater than 0,15 MeV) and alpha-emitters*

ISO 11929-1:2000, *Determination of the detection limit and decision threshold for ionizing radiation measurements – Part 1: Fundamentals and application to counting measurements without the influence of sample treatment*

3 Terms and definitions

The general terminology concerning the detection and measurement of ionizing radiation and nuclear instrumentation is given in IEC 60050(393) and IEC 60050(394).

For the purposes of this International Standard, the following definitions apply:

3.1

effective range of measurement

range of values of the quantity to be measured over which the performance of a meter or monitor meets the requirements of this standard

3.2

surface emission rate of a source, $q/2\pi$

number of particles of a given type above a given energy emerging from the front face of the source per unit time.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0dfef584-1fa7-4750-9b08-deb4766ce7af/iec-60325-2002>

3.3

source efficiency, ϵ_s

ratio between the number of particles of a given type above a given energy emerging from the front face of a source or its window per unit time (surface emission rate) and the number of particles of the same type created or released within the source (for a thin source) or its saturation layer thickness (for a thick source) per unit time

3.4

high efficiency source

source in which the efficiency for particles with an energy greater than 5,9 keV is greater than 0,25, including backscattered particles. (This definition applies to beta emitters with a maximum energy >150 keV).

3.5

small area source

source whose active surface area has a maximum linear dimension not exceeding 1 cm

3.6

surface emission rate response (instrument efficiency)

under stated conditions specified by the manufacturer (sensitive area of the detector, sensitive area of the source and the distance between source and detector), the surface emission rate response (efficiency) of the detector used in conjunction with the assemblies is the ratio of the number of detected particles (for instance counts per unit time, corrected for background) to the number of particles of the same type emitted by the radiation source in the same interval of time (conventionally true surface emission rate)